

PG2000D 雙面半自動探針台

為針對DIODE、MOSFET、IGBT等產業元件的晶圓測試。

PEGASUS PG2000D是一台雙面四線探針結構的探針台，此結構可消除探針平台上的阻抗問題，使其對測試結果的影響降到最低，可讓被測元件更接近於工程設計之要求。



性能特点

- 落地一體式設計，體積輕巧
- 支援Windows系統，中文軟體介面，即時mapping圖顯示
- 按鍵搭配搖桿的簡易操作，輕鬆實現所有測試要求
- 高精密馬達驅動，提供安靜且穩定的運行環境
- 模組化電控機構，易於維修
- 雙面探針結構，改善測試回路阻抗，測試電流可達30A
- 可點測3”到8”晶片
- 可因客戶需求提供客制化的設計
- 提供TTL、RS232通訊方式，可搭配各種測試機
- 優越的點測速度及極佳的探針針痕

PG2000D 雙面半自動探針台

技術規格

XY軸

- 架構：高精度循環式滾珠螺桿
- 行程：210mm×210mm
- 解析度：0.5 μm
- 精度： $\leq \pm 7 \mu\text{m}$ (210mm範圍)
- 準確度： $\leq \pm 4 \mu\text{m}$ (210mm範圍)

探針手臂

- 行程：10 μm
- 解析度：1.0 μm
- 精度： $\leq \pm 2 \mu\text{m}$
- 準確度： $\leq \pm 4 \mu\text{m}$

平台

- 材質：高絕緣人造石頭版
- 夾片尺寸：3"/4"/5"/6"/8"
- 旋轉角度： ± 10.0 度
- 解析度：0.001度

顯微鏡

- 目鏡：20x
- 物鏡：1x ~ 4.5x
- 放大倍率：20x ~ 90x

外觀尺寸

- 90 (D) x 70 (W) x 173 (H) cm
(含顯微鏡及顯示幕，不含信號燈)

測試時間

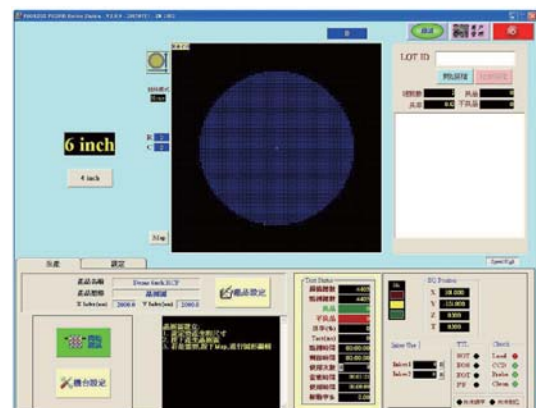
Test Time (ms)		Index Step(μm)			
		300	500	1000	2000
Chuck Lift (μm)	300	50	58	72	91
	500	62	69	83	102
	800	77	84	98	118
	1000	87	94	108	127

重量

- 250 KG

選配

- 各類顯微鏡
- CCD Camera



全中文操作介面，可即時顯示Mapping圖